

| ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСНЫХ ДЫРОК  
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ  
БЕСЩЕЛЕВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Арапов Ю. Г., Давыдов А. Б., Зверева М. Л., Штрапенин Г. Л.

Методом магнитоплазменной отсечки СВЧ волн миллиметрового диапазона при температурах 1.7 и 4.2 К измерена диэлектрическая проницаемость  $\chi$  бесщелевых полупроводников  $p\text{-Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  ( $x \approx 0.15$ ). Для образца с  $(N_A - N_D) = 1.6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  при  $T = 1.7 \text{ K}$  экспериментальное значение  $\chi = 13$  и уменьшается с ростом температуры. Заниженное значение  $\chi$  по сравнению с диэлектрической проницаемостью решетки  $\chi_L = 16$  связывается с отрицательным вкладом делокализованных дырок, которые активированы на край подвижности, расположенный вблизи уровня Ферми. Для образца с  $(N_A - N_D) = 7.2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$  при гелиевых температурах дырки локализованы, а повышенное значение  $\chi = 32$  объясняется поляризацией микронеоднородностей, образующихся в полупроводнике из-за неоднородного распределения заряженных примесей.

В работе [1] показано, что в случае, когда амплитуда флюктуаций примесного потенциала  $\gamma$  сравнима по величине с энергией Ферми  $\epsilon_F$ , диэлектрическая проницаемость бесщелевых полупроводников (БП)  $\chi$  становится больше суммарной диэлектрической проницаемости  $\chi_0 = \chi_L + \Delta\chi$  ( $\chi_L$  — диэлектрическая проницаемость решетки,  $\Delta\chi$  — приращение, обусловленное межзонными переходами  $\Gamma_8 \rightarrow \Gamma_8$ ). Увеличение  $\chi$  связано с поляризацией пространственных неоднородностей плотности заряда, которые имеют место в образце при  $\gamma \geq \epsilon_F$  [1]. Наряду с зонными электронами в переносе заряда в БП могут принимать участие дырки акцепторной зоны. Если эти дырки локализованы на акцепторах (проводимость по акцепторной зоне носит прыжковый характер), их вклад  $\Delta\chi_p$  в диэлектрическую проницаемость кристалла незначителен и имеет положительный знак [2]. Если же дырки делокализованы (проводимость по примесной зоне носит металлический характер), то следует ожидать, что их вклад в диэлектрическую проницаемость будет отрицательным и может быть записан в виде [3]

$$\Delta\chi_p = -\frac{\omega_p^2 \tau_p^2}{1 + \omega^2 \tau_p^2}. \quad (1)$$

Здесь  $\omega_p^2 = 4\pi pe^2/m_p$  — плазменная частота для дырок,  $p$ ,  $m_p$  и  $\tau_p$  — концентрация, эффективная масса и время релаксации импульса дырок,  $\omega$  — круговая частота, на которой проводится измерение  $\chi$ . Таким образом, из измерений диэлектрической проницаемости БП можно установить характер проводимости дырок по акцепторной зоне.

Образец	$n \cdot 10^{-14}, \text{ см}^{-3}$	$\frac{m_F}{m_0} \cdot 10^3$	$\mu \cdot 10^{-5}, \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ ( $T = 1.7 \text{ K}$ )	$\epsilon_F, \text{ мэВ}$	$\epsilon_g, \text{ мэВ}$	$\chi_0$	$\chi$		$(N_A - N_D) \times 10^{-16}, \text{ см}^{-3}$	$\gamma, \text{ мэВ}$
							$T = 1.7 \text{ K}$	$T = 4.2 \text{ K}$		
943-13	2.6	3.6	5.8	4.6	-36	24	13	9.3	16	3.4
943-14	1.2	3.0	11	3.1	-31	25	32	32	7.2	3.2

В данной работе с целью выяснения влияния примесных дырок на диэлектрическую проницаемость БП  $p\text{-Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  мы измерили  $\chi$  для двух образцов, параметры которых приведены в таблице. Значения концентраций  $n$  и эффективных масс электронов на уровне Ферми  $m_F$  найдены из измерений положения осцилляций Шубникова—де-Гааза продольного и поперечного магнитосопротивления в магнитном поле и температурной зависимости амплитуды этих осцилляций. Фермиевская энергия  $\epsilon_F$  вычислена в приближении двухзонной модели Кейна при значении матричного элемента  $P=8.4 \cdot 10^{-8}$  эВ·см. Величина разностной концентрации акцепторов и доноров ( $N_A - N_D$ ) определялась из измерений концентрации дырок при температуре истощения акцепторов ( $\sim 77$  К). Как видно из таблицы,  $(N_A - N_D)$  для исследованных образцов несколько меньше критической концентрации акцепторов  $N_{A_{\text{кр}}} \approx 2.5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  [4], при которой происходит переход металл—диэлектрик для дырок.

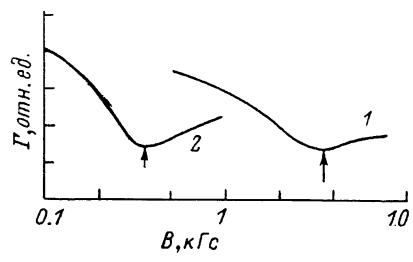


Рис. 1. Зависимость от магнитного поля коэффициента отражения СВЧ волны длиной  $\lambda=1.43$  мм в конфигурации Фогта.

1 — образец Э43-13, 2 — образец Э43-14. Т, К: 1 — 4.2, 2 — 1.7.

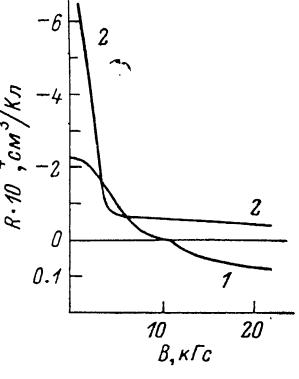


Рис. 2. Зависимость коэффициента Холла  $R$  от магнитного поля. Т=1.7 К. 1 — образец Э43-13, 2 — образец Э43-14.

Измерения  $\chi$  проводились методом магнитоплазменной отсечки при температурах 1.7 и 4.2 К в субмиллиметровом диапазоне длин волн  $\lambda=0.143-0.165$  см. На рис. 1 приведены экспериментальные зависимости коэффициента отражения  $\Gamma$  от магнитного поля  $B$ . Стрелками отмечены значения индукции магнитного поля  $B_m$ , при которых наблюдается минимум на зависимости  $\Gamma(B)$ . Для образца Э43-13 значения диэлектрической проницаемости находились из соотношения

$$\chi = 2en\lambda/B_m, \quad (2)$$

а для образца Э43-14 определялись как подгоночный параметр из сравнения рассчитанных и измеренных на разных длинах волн зависимостей  $\Gamma(B)$ , так как в области малых магнитных полей, при которых наблюдаются минимумы на кривых  $\Gamma(B)$  для образца Э43-14, формула (2)<sup>1</sup> становится неточной [1]. Определенные таким образом значения  $\chi$  приведены в таблице. Там же указаны рассчитанные величины суммарной диэлектрической проницаемости  $\chi_0 = \chi_L + \Delta\chi$ , где  $\chi_L = 16$  [5],  $\Delta\chi = \frac{4e^2}{\pi\hbar} \left( \frac{2m_F}{\epsilon_F} \right)^{1/2}$  [6].<sup>2</sup> Как видно из таблицы, экспери-

<sup>1</sup> Формула (2) справедлива при выполнении условий, приведенных в [1] и, в частности, при выполнении неравенства  $\omega/\omega_c \ll 1$  ( $\omega_c$  — циклотронная частота электронов,  $\omega$  — круговая частота СВЧ излучения). Для образца Э43-13 при  $\lambda=0.15$  см величина  $\omega/\omega_c \approx 1$ .

<sup>2</sup> Выражение для величины  $\Delta\chi$ , характеризующей вклад в диэлектрическую проницаемость межзонных переходов  $\Gamma_8 \rightarrow \Gamma_8$ , так же как и выражение для внутризонной диэлектрической проницаемости Фогта электронов в магнитном поле, из которого следует формула (2) [1], записано в приближении параболического закона дисперсии для электронов зоны проводимости. Данное приближение справедливо при выполнении условия  $\epsilon_F/\epsilon_g \ll 1$  [ $\epsilon_g = \epsilon(\Gamma_8) - \epsilon(\Gamma_8)$  — энергетический зазор между зонами  $\Gamma_6$  и  $\Gamma_8$  бесщелевого полупроводника] и достаточно хорошо выполняется для исследованных образцов (см. таблицу). Влияние непараболичности на вероятность межзонных переходов  $\Gamma_8 \rightarrow \Gamma_8$  при записи выражения

ментальные значения  $\chi$  для образца Э43-14 оказываются больше рассчитанных величин  $\chi_0$ , а для образца Э43-13 — меньше диэлектрической проницаемости решетки  $\chi_L$ , причем для второго образца величина  $\chi$  уменьшается при возрастании температуры от 1.7 до 4.2 К.

Тот факт, что измеренная диэлектрическая проницаемость для образца Э43-14 получается больше рассчитанной, нетрудно понять, если сравнить энергию Ферми  $\epsilon_F$  с амплитудой флуктуаций примесного потенциала  $\gamma = \sqrt{2\pi} \frac{e^2}{\chi_0} (N_I r_e)^{1/2}$ , где  $r_e = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{3}\right)^{1/3} \left(\frac{a_e}{n^{1/3}}\right)^{1/2}$  — радиус экранирования заряженных центров свободными электронами,  $N_I$  — концентрация заряженных центров,  $a_e$  — боровский радиус электрона. Так как для образца Э43-14 амплитуда флуктуаций  $\gamma$  сравнима с  $\epsilon_F$ , пространственное распределение заряда в нем неоднородно. Это приводит к появлению дополнительной поляризации во внешнем электрическом поле и увеличению  $\chi$  по сравнению с  $\chi_0$  [1].

Для образца Э43-13 уменьшение  $\chi$  по сравнению с  $\chi_0$  можно объяснить влиянием делокализованных дырок, двигающихся по акцепторной зоне (концентрация валентных дырок при  $1.7 \leq T \leq 4.2$  К незначительна и их вкладом в  $\chi$  можно пренебречь). Чтобы проверить это предположение, сравним зависимости коэффициента Холла  $R$  от магнитного поля для образцов Э43-13 и Э43-14 при гелиевых температурах. Эти зависимости (рис. 2) имеют вид, характерный для полупроводников с двумя сортами носителей заряда с сильно различающимися подвижностями. Для образца Э43-14 коэффициент Холла в магнитных полях, значительно больших поля вымораживания  $B_0 = 1.4$  кГс [4] электронов на акцепторные состояния и в ямы примесного потенциала [9], остается отрицательным. Это означает, что вторым сортом носителей заряда для образца Э43-14 являются электроны с низкой подвижностью, в качестве которых могут выступать поверхностные электроны [4] или электроны, локализованные в ямах примесного потенциала [9, 10]. Поверхностные электроны не оказывают влияния на положение минимума коэффициента отражения [1], а поляризация электронов в ямах примесного потенциала, как уже говорилось ранее, может лишь увеличить  $\chi$ . Для образца Э43-13 коэффициент Холла с ростом магнитного поля меняет знак с отрицательного на положительный. Поэтому вторым сортом носителей заряда для этого образца являются примесные дырки. Концентрацию примесных дырок можно найти из измерений коэффициента Холла в магнитных полях  $\sim 20$  кГс, когда зависимость  $R(B)$  близка к насыщению (рис. 2). При  $T=1.7$  К величина  $p$  составляет  $\sim 7.5 \cdot 10^{15}$  см<sup>-3</sup> и с ростом температуры увеличивается приблизительно по степенному закону  $p \sim T^\alpha$ , где  $\alpha \approx 2/3$ . Зная концентрацию примесных дырок, можно оценить их подвижность по величине отрицательного вклада в диэлектрическую проницаемость из равенства (1)

$$\Delta\chi_p = \chi_0 - \chi. \quad (3)$$

Значения  $\mu_p = e\tau_p/m_p$ , вычисленные из (3) при  $m_p = 0.45m_0$  [4] для температур 1.7 и 4.2 К, составляют соответственно 2000 и 1700 см<sup>2</sup>/В·с, что приблизительно в 2 раза больше значений подвижности 960 и 700 см<sup>2</sup>/В·с, полученных из электропроводности дырок  $\sigma_p = ep/\mu_p$  на постоянном токе. Электропроводность дырок находилась по формуле

$$\sigma_p = \sigma(T) [1 - \sqrt{R(T)/R(0)}], \quad (4)$$

для  $\Delta\chi$  можно частично учесть, подставив в формулу величину эффективной массы электронов на уровне Ферми  $m_F$  [1].

<sup>3</sup> Для оценки  $\gamma$  концентрация заряженных центров находилась из сравнения измеренной при  $T=4.2$  К подвижности электронов с рассчитанной при условии, что рассеяние импульса электронов происходит только на заряженных центрах. При таком способе определения  $N_I$  мы пренебрегаем резонансным рассеянием электронов на нейтральных акцепторах [7] и тем самым завышаем величину  $N_I$ . Последнее обстоятельство должно играть большую роль для образца Э43-13, чем для образца Э43-14, так как уровень Ферми у образца Э43-13 лежит ближе к центру акцепторной зоны. Центр акцепторной зоны у БП  $Hg_{1-x}Cd_xTe$  с  $x \approx 0.15$  располагается на 5–6 мэВ выше потолка валентной зоны [8].

где  $\sigma(T)$  и  $R(T)$  — электропроводность кристалла и коэффициент Холла при соответствующей температуре в слабом магнитном поле ( $B \rightarrow 0$ );  $R(0) = 2.4 \cdot 10^4 \text{ см}^3/\text{Кл}$  — значение коэффициента Холла при  $T \rightarrow 0$ .

Следует отметить, что подвижность  $\sim 1000 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$  соответствует минимальной металлической подвижности дырок в  $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  [9], характерной для безактивационного движения по акцепторной зоне. Причина различия подвижностей дырок, найденных из  $\Delta\chi_p$  и  $\sigma_p$ , становится ясной, если учесть, что примесные дырки не вырождены (их концентрация зависит от температуры). Для невырожденных дырок на длинах СВЧ волн  $\lambda = 0.14 - 0.17 \text{ см}$  выполняется условие  $\omega^2\tau_p^2 \ll 1$ , и отношение  $\sqrt{\Delta\chi_p}/\sigma_p$  пропорционально квадратному корню из величины холл-фактора  $A = \langle\tau_p^2\rangle/\langle\tau_p\rangle^2$ . При рассеянии на заряженных центрах в однородной среде  $A = 1.93$ , а при движении носителей заряда в неоднородной среде может быть значительно больше единицы [11]. В частности, такой неоднородной средой является система акцепторов в области минимальной металлической проводимости.

Таким образом, измерения диэлектрической проницаемости и зависимости коэффициента Холла от магнитного поля для образца Э43-13 показали, что перенос заряда по акцепторной зоне у этого образца при  $T \geq 1.7 \text{ К}$  осуществляется делокализованными примесными дырками. Отрицательный вклад в диэлектрическую проницаемость пропорционален концентрации дырок и увеличивается с ростом температуры. Степенной характер температурной зависимости концентрации делокализованных дырок свидетельствует о том, что эти дырки активированы на край подвижности, который находится вблизи уровня Ферми, следовательно, расположен на  $\sim 4.5 \text{ мэВ}$  выше потолка валентной зоны. Следует отметить, что положение края подвижности является важной характеристикой, которую необходимо знать при исследовании явлений переноса вблизи перехода металл—диэлектрик, но обычно не удается определить в полупроводниках с открытой щелью.

Для образца Э43-14 величина разностной концентрации ( $N_A - N_D$ ) меньше, а уровень Ферми расположен дальше от центра акцепторной зоны по сравнению с образцами Э43-13, плотность акцепторных состояний на уровне Ферми у образца Э43-14, по-видимому, меньше, чем у образца Э43-13. В связи с этим при гелиевых температурах примесные дырки в образце Э43-14 локализованы и не оказывают заметного влияния на диэлектрическую проницаемость.

В заключение авторы выражают благодарность И. М. Цидильковскому за обсуждение работы.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Арапов Ю. Г., Давыдов А. Б., Штрапенин Г. Л., Горбатюк И. Н., Раренко И. М. — ФТП, 1986, т. 20, в. 3, с. 462—467.
- [2] Pollak M., Geballe T. H. — Phys. Rev., 1961, v. 122, N 6, p. 1742—1753.
- [3] Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М., 1974. 472 с.
- [4] Tsidilkovski I. M., Harus G. I., Shelushinina N. G. — Adv. Phys., 1985, v. 34, N 1, p. 43—174.
- [5] Grynberg M., Le Toullec R., Balkanski M. — Phys. Rev. B, 1974, v. 9, N 2, p. 517—526.
- [6] Liu L., Brust D. — Phys. Rev. Lett., 1968, v. 20, N 13, p. 651—653.
- [7] Райх М. Э., Эфрос А. Л. — ФТТ, 1986, т. 28, в. 5, с. 1307—1316.
- [8] Гельмонт Б. Л., Дьяконов М. И. — ЖЭТФ, 1972, т. 62, в. 2, с. 713—724.
- [9] Арапов Ю. Г., Давыдов А. Б., Зверева М. Л., Стафеев В. И., Цидильковский И. М. — ФТП, 1983, т. 17, в. 8, с. 1392—1396.
- [10] Аронзон Б. А., Копылов А. В., Мейлихов Е. З., Горбатюк И. Н., Раренко И. М., Тальянский Э. В. — ЖЭТФ, 1985, т. 89, в. 1 (7), с. 126—133.
- [11] Потапов В. Т., Трифонов В. И., Чусов И. И., Яременко Н. Г. — ФТП, 1972, т. 6, в. 7, с. 1227—1233.